

令和7年2月13日

超顕微解析研究センター利用者 各位

超顕微解析研究センター
センター長 村上 恭和

電顕利用枠（時間帯設定）と利用料金に関わるお知らせ

日頃より超顕微解析研究センターの活動に対してご支援を賜り、御礼を申し上げます。

掲題の件についてご案内と、お願いを申し上げます。センター内での検討のほか、利用者の代表として本センター専門委員の皆様から頂戴した意見を踏まえてのご案内となりますが、お目通しのほど、お願い申し上げます。

1. 利用枠（時間帯設定）の変更について

本センターの装置は利用者ご自身が操作することを原則としていますが、設備や実験内容の高度化、新たな研究グループの参画、学内外の研究プロジェクトが関わる案件など、様々な理由から、センターの職員がサポートを差し上げるケースが激増しています。サポートは第1枠と第2枠の利用者を対象に実施していますが、第2枠終了の18時30分以降に片付・整理の業務を行うため、職員の超過勤務が恒常的になっております。

このため、センター職員の労務管理の観点から、令和7年4月1日より、電顕利用枠（時間帯設定）を次のように変更させていただきたく、ご連絡を申し上げます。

現行 : 第1枠 : 10:00-14:00 第2枠 : 14:30-18:30 第3枠 : 19:00-23:00
R7.4以降 : 第1枠 : 9:30-13:00 第2枠 : 13:30-17:00 第3枠 : 17:30-21:00

開始・終了時刻や1枠あたりの長さの変更については、利用者様への影響という観点で議論を重ねて参りました。同時に、第1枠に先立つ調整作業時間（30分～1時間）の確保や、労務管理目線での第2枠の終了時刻設定 ※1、※2などを考慮し、上記「R7.4以降」の形態が適切との判断に至りました。何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

※1 : 終了時刻 17:00 の設定については、他機関の電顕センターの設定も考慮しました。

※2 : 終了時刻 17:00 の後、センター職員による片付けやデータ整理等が実施されます。

なお、EDS 元素マッピングなど長時間の継続実験が必要な場合は、これまで通り、第1 枠と第2 枠の空き時間(13:00-13:30)をまたいだ連続測定や、各グループの熟練者の同席のもと第3 枠を有効にご利用頂く事で、引き続きご対応頂ければ幸甚に存じます。

2. 利用料金について

ここ数年の物価高騰や電気代の値上がりのため、現在の利用料金（過去の物価状況をもとに定めた利用料金）では、装置の維持管理費の捻出が年々困難な状況になっています。一方、現時点での物価や電気代をそのまま反映し利用料金を算出すると、前述の通り1 枠あたりの長さが4 時間から3.5 時間に短縮されたにも関わらず、枠あたりの利用料金が現在よりも相当高額となります。このため、運営上の理由から、今回は電気代高騰の部分だけを料金改定に反映させて頂き、物価高騰に伴う負担は引き続きセンターの自助努力で対応することで、利用者の皆様の研究活動にできる限り影響が及ばぬよう、配慮・対応させて頂く所存でございます。

このような次第で、令和7 年4 月1 日より、別添の通りの利用料金で運用させて頂きたく、利用者の皆様のご理解・ご了承をお願い申し上げます。上記の通り1 枠あたりの長さは（4 時間から3.5 時間に）短縮されますが、電気代の高騰部分のみ考慮させて頂きました。結果的に、枠あたりの利用料金はこれまでと大きな変更なしという形に調整されています（電気代更新に伴う端数調整等で、一部の装置は1,000 円以内の増加となっております。あわせてご了解のほど、お願い申し上げます。）

本センターとしては、先端設備を駆使した基盤的な顕微解析に加えて、オリジナリティに富んだ新技術を学内利用者に提供するなど、引き続き努力を重ねて参ります。また旧超高压電顕室から継続している教育プログラム（研修会）も、最先端の装置の活用を見据えた内容を適宜取り込んで行きたいと思っております。引き続きご支援のほどお願い申し上げます。

超顕微解析研究センター電顕利用料金

令和7年4月1日改訂予定

第1枠：9:30-13:00

第2枠：13:30-17:00

第3枠：17:30-21:00

装置名	現行料金	新料金
超高圧電子顕微鏡 JEM-1300NEF	15,000	15,000
新高分解能電子顕微鏡 JEM-ARM300F2	18,000	18,000
広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡 JEM-ARM200CF	15,000	16,000
収差補正走査／透過電子顕微鏡 JEM-ARM200F	14,000	15,000
ホログラフィー電子顕微鏡 HF-3300X	11,000	12,000
汎用電子顕微鏡 JEM-2100F	9,000	8,600
ハイコントラスト補助電子顕微鏡 JEM-2100HCKM	6,100	6,200
マイクロカリーメータ-高エネルギー分解能元素分析装置付き走査電子 顕微鏡 TES+ULTRA55	7,700	7,800
デュアルビームFIB Quanta 3D 200i	13,000	13,000
直交型FIB-SEM MI4000L	19,000	17,000
イオンビーム・電子ビーム複合型精密加工分析装置 Helios 5 UX	24,000	24,000
クロスセクションポリッシャ	2,500	2,500
グローブボックス	7,000	6,900
PIPS II M-695	1,100	990
Nano MILL Model 1040	1,100	990
イオンスライサー EM-09100IS	1,100	990

赤字：値上げ 水色：値下げ